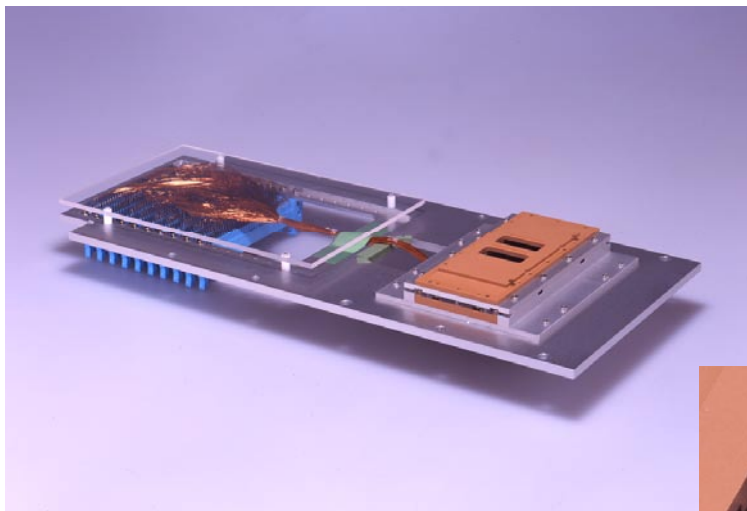


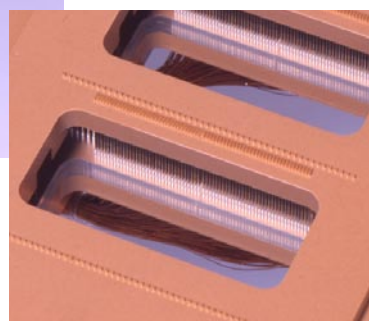
TAB / COFキャリアテープ検査用テストヘッド

TAB / COF Carrier Tape / TCP Test Head

yokowo



TAB / COFキャリアテープ検査用テストヘッド



用途

- ・TABテープおよびCOFのオープンショート検査
- ・TCP (TAB IC) ファンクション検査

特長

- ・垂直構造プローブ採用により多数個同時検査に対応
- ・メンテナンス性を重視したプローブ交換方式を採用
- ・コンタクトプローブ方式にて最小ピッチ0.15mmを実現
- ・0.15mm～0.9mmピッチ以上までの6種類のプローブを混載することによる大幅なコストメリット
- ・プランク、工程、作業の標準化により短納期化を実現

仕様

テストヘッド材質	セラミック/スーパーエンブラ
テープ幅	35W, 35SW, 48W, 48SW, 70W, 70SW and others
プローブ先端位置精度	± 0.02mm 以下
プローブ最大ストローク	0.6mm
絶縁抵抗	100MΩ 以上